



고 배율 원샷 자동 측정기

MX3200 시리즈

나노미터에서 **수백** 미터까지!

CHOTEST는 최상의 정밀 측정 솔루션을 제공합니다.



MX 3200

고 배율 원샷 자동 측정기



개요

- MX3200 고배율 측정기는 현미경과 기존 비디오 측정을 결합하여 아주 미세한 시료 측정에 적합 합니다.
- 렌즈 회전대는 프로그램 제어로 전환되며 시료에 따라 다양한 배율로 2차원 형상을 측정 합니다.
- 2차원 치수 점, 선, 원 등을 측정하고 형상 및 위치 공차를 평가할 수 있습니다
- MX3200 측정기는 정밀 기계, 광통신 장치, 정밀 금형, 자성 재료, 정밀 스탬핑, 휴대폰 정밀 액세서리, 의료 장비, 계측 및 테스트 등 산업 전 분야에 걸쳐 널리 사용할 수 있습니다.

적용



반도체 패턴 및 소형 부품 확대 이미지

사양

모델		MX3200		
대물렌즈		10×	20×	50×
이미지 센서		고해상 산업용 컬러 카메라		
모니터		24" LED모니터 (XGA: 1920×1080)		
렌즈회전 대		3구 수동 / (옵션 : 전동 5구)		
시야		0.98×0.98mm	0.49×0.49mm	0.196×0.196mm
수평 해상도		2μm	1μm	0.4μm
정밀도	고정	±0.3μm	±0.2μm	±0.1μm
	이동 Ex/Ey	±(2.0+0.02L)μm		
반복성		±0.1μm	±0.1μm	±0.05μm
단차 측정	정밀도	±(3.0+L/100)μm		
	반복성	±1μm		
측정 범위	X	210mm		
	Y	110mm		
	Z	75mm		
표시 해상도		0.1μm		
조명	동축	동축조명		
	투과	평행 투시 조명 (녹색)		
높이 측정 센서	홀깊이비율	1.5		
	측정높이	±3.5mm		
	정밀도	±2.0μm		
측정소프트웨어		VisionX		
최대 측정 속도	XY	80 mm/s		
	Z	25 mm/s		
외형사이즈(L×W×D)		531×455×761mm		
중량		74kg		
적재하중		5kg		
입력전원		100-240VAC,50/60Hz,2A/300W		
설치환경		온도 10°C~35°C, 습도 20~80% (무응축)		



(주) 나노정밀코리아

인천시 연수구 송도미래로 30, 송도스마트밸리 D동 802호

Tel : 032-875-7005 | Fax : 032-817-7009

e-Mail : nikonkorea @ msn.com

<http://www.nanokorea.kr>